



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100305001
2010 年 3 月 25 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HVAL-SLL (汎用リニアロジック) T092 パッケージ 一部製品 組立サイト追加予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	■Initial notice (Plan)		□Final notice	
変更概要	Design/Specification	□Design	□Electrical	□Mechanical
	Wafer Fab	□Site	□Process	□Material
	Wafer Bump	□Site	□Process	□Material
	■Assembly	■Site	□Process	□Material
	Test	□Site	□Process	
	■Others	■Packing/Shipping/Labeling		□ -
変更内容	HVAL-SLL (汎用リニアロジック) T092 パッケージ 一部製品 組立サイト追加 現行 : NFME 社(中国) 変更後: NFME 社(中国), ASE-Weihai 社(中国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	6 月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	■計画		□終了	
製品表示	□変更無し		■変更あり	
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、認定試験の結果を含め、本PCNの更新版の発行をもって連絡させていただきます。尚、変更品の出荷につきましては、本通知の90日以降に予定いたしております。

弊社 HVAL-SLL(汎用リニアロジック) T092パッケージ 一部製品の組立サイトについて、現行 NFME (Nantong-Fujitsu) 社(中国) サイトにて製造しておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、ASE-Weihai社(中国)サイトを追加する予定です。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容
組立サイト

現行
NFME社(中国)

変更後
NFME社(中国)
ASE-Weihai社(中国)

理由: 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
TL431ACLP	TL431BILPR	TL431ILPR	TLV431BQLPE3	TLVH431BCLP
TL431ACLPE3	TL431BILPRE3	TL431ILPRE3	TLV431BQLPR	TLVH431BCLPE3
TL431ACLPE3-Z	TL431BQLP	TL431ILPRE3-J	TLV431BQLPRE3	TLVH431BCLPR
TL431ACLPM	TL431BQLPE3	TL431ILPR-J	TLV431CLP	TLVH431BCLPRE3
TL431ACLPME3	TL431BQLPM	TL7757ILPR	TLV431CLPE3	TLVH431BILP
TL431ACLPR	TL431BQLPME3	TL7757ILPRE3	TLV431CLPM	TLVH431BILPE3
TL431ACLPRE3	TL431BQLPR	TLV431ACLP	TLV431CLPME3	TLVH431BILPR
TL431ACLPRE3-J	TL431BQLPRE3	TLV431ACLPRE3	TLV431CLPR	TLVH431BILPRE3
TL431ACLP-Z	TL431CLP	TLV431ACLPRE3	TLV431CLPRE3	TLVH431BQLP
TL431AILP	TL431CLPE3	TLV431ACLPRE3	TLV431ILP	TLVH431BQLPE3
TL431AILPE3	TL431CLPE3-J	TLV431AILP	TLV431ILPE3	TLVH431BQLPR
TL431AILPM	TL431CLPE3-Z	TLV431AILPE3	TLV431ILPR	TLVH431BQLPRE3
TL431AILPME3	TL431CLP-J	TLV431AILPM	TLV431ILPRE3	TLVH431CLP
TL431AILPR	TL431CLPM	TLV431AILPME3	TLVH431ACLP	TLVH431CLPE3
TL431AILPRE3	TL431CLPME3	TLV431AILPR	TLVH431ACLPRE3	TLVH431CLPR
TL431AILPRE3-J	TL431CLPME3-J	TLV431AILPRE3	TLVH431ACLPRE3	TLVH431CLPRE3
TL431AILPR-J	TL431CLPM-J	TLV431BCLP	TLVH431ACLPRE3	TLVH431ILP
TL431BCLP	TL431CLPR	TLV431BCLPE3	TLVH431AILP	TLVH431ILPE3
TL431BCLPE3	TL431CLPRE3	TLV431BCLPR	TLVH431AILPE3	TLVH431ILPR
TL431BCLPM	TL431CLPRE3-J	TLV431BCLPRE3	TLVH431AILPR	TLVH431ILPRE3
TL431BCLPME3	TL431CLPR-J	TLV431BILP	TLVH431AILPRE3	TLVH431QLP
TL431BCLPR	TL431CLP-Z	TLV431BILPE3	TLVH431AQLP	TLVH431QLPE3
TL431BCLPRE3	TL431ILP	TLV431BILPR	TLVH431AQLPE3	TLVH431QLPR
TL431BILP	TL431ILPE3	TLV431BILPRE3	TLVH431AQLPR	TLVH431QLPRE3
TL431BILPE3	TL431ILPME3-J	TLV431BQLP	TLVH431AQLPRE3	

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L, 23L)が下記のようになる予定です。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)	組立国コード(23L)
現行	NFME	ASO: NFM	ACO: CHN
追加認定	ASE-Weihai	ASO: AWH	ACO: CHN



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験計画					
信頼性試験期間	開始	2009 年 12 月 6 日	終了	2010 年 5 月 15 日	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qual Device:	LM385BLP-1-2			-	-
Assembly Site:	ASEWH	Package/Code/Pins:		TO/LP/3	
Mount Compound:	Ablestik E&C	Mold Compound:		ST-7100DS	
Wire:	1.0 mil Dia, Au	Leadframe:		side collected	
信頼性試験計画					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size			Notes
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
Steady-State Life Test	150C, 168, 300 Hrs	77	77	77	-
High Temp Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77	77	77	(1)
Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77	(2)
Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77	(3)
Temp Cycle	-65C/150C, 500cyc	77	77	77	-
Solder Heat	260C, 10 seconds	22	22	22	-
Solderability	Post 8 Hrs/Stm Age	22	22	22	-
Lead Pull	# of leads to destruction, min. 3 units	22	22	22	-
Lead Fatigue	# of leads, min. 3 units	22	22	22	-
Lead Finish Adhesion	# of leads, min. 3 units	22	22	22	-
Physical Dimensions	Per Package Drawing	5	5	5	-
Flammability	Method A – UL94-0	5	5	5	-
Flammability	Method B – IEC 695-2-2	5	5	5	-
Flammability	Method C – UL 1694	5	5	5	-
Salt Atmosphere	24 Hours	22	22	22	-
Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hours	22	22	22	-
X-Ray	Topside only	5	5	5	-
Ball Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units	5	5	5	-
Die Shear	-	10	10	10	-
Wire Pull	min 76 wires	76	76	76	-
Manufacturability	per Assembly Site spec	per spec			-
Visual / Mechanical	-	328	328	328	-
Notes:					
(1) Storage Bake units are to be electrically test within 96 hours of stress					
(2) HAST units must be electrically tested within 48 hours after stress					
(3) Autoclave units must be electrically tested within 48 hours after stress					

信頼性試験計画					
信頼性試験期間	開始	2009 年 12 月 6 日	終了		2010 年 5 月 15 日
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qual Device:	TL431ACLP			-	-
Assembly Site:	ASEWH	Package/Code/Pins:		TO/LP/3	
Mount Compound:	Ablestik E&C	Mold Compound:		ST-7100DS	
Wire:	1.0 mil Dia, Au	Leadframe:		side collected	
信頼性試験計画					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size			Notes
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
Steady-State Life Test	150C, 168, 300 Hrs	77	77	77	-
Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77	(1)
Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77	(2)
Temp Cycle	-65C/150C, 500cyc	77	77	77	-
Solder Heat	260C, 10 seconds	22	22	22	-
Solderability	Post 8 Hrs/Stm Age	22	22	22	-
Lead Pull	# of leads to destruction, min. 3 units	22	22	22	-
Lead Fatigue	# of leads, min. 3 units	22	22	22	-
Lead Finish Adhesion	# of leads, min. 3 units	15	15	15	-
Physical Dimensions	Per Mechanical Drawing	5	5	5	-
X-Ray	Topside only	5	5	5	-
Ball Bond Shear	76 ball bonds	5	5	5	-
Die Shear	-	10	10	10	-
Wire Pull	min 76 wires	76	76	76	-
Manufacturability	per Assembly Site spec	per spec			-
Visual / Mechanical	-	328	328	328	-
Notes:					
(1) HAST units must be electrically tested within 48 hours after stress					
(2) Autoclave units must be electrically tested within 48 hours after stress					